



BETTER DETECTION.
BETTER PREVENTION.
BETTER SOLUTIONS.



Follow us on

分析展・2010

Better Detection. Better Prevention. Better Solutions.

パーキンエルマーは皆様のニーズを把握し、共に問題解決をしていくパートナーです！

分析機器メーカーのパイオニアであるパーキンエルマー社の多種多様な製品ラインナップに加え、今年は、新製品の実機を取りそろえ展示します。
また、これら製品を用いた新技術説明会、昨年ご好評いただいたブース内ミニセミナーを開催します。

この機会にぜひ、パーキンエルマー・ジャパンのテクノロジー＆ソリューションをご体感ください。
みなさまのご来場を、社員一同心からお待ちしております。

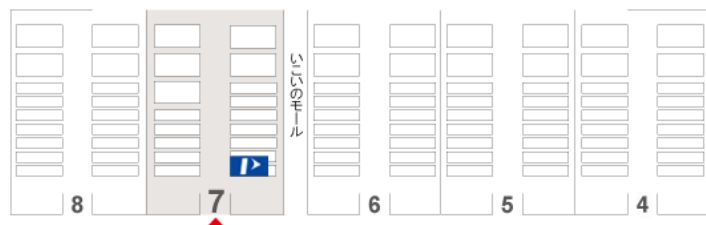
詳細はこちら、

JAIMA特設WEBサイト (<http://www.perkinelmer.co.jp/pex2010/index.html>)

Twitter (http://twitter.com/perkinelmer_jp/)

ブース概要

会期： 2010年9月1日(水)～9月3日(金)
時間： 10:00 ～ 17:00
会場： 幕張メッセ国際展示場 4～8ホール 入場無料
ブースNo.： 7ホール#7A-103、7A-202 (下図)



主な出展予定装置



NexION
ICP質量分析装置



DSC-Raman
ハイフエネーテッドシステム
- 複合熱分析システム -



Flexar LC
液体クロマトグラフ



Flexar LC/MS
液体クロマトグラフ質量分析計

【ご注意】

事前登録をせずにご来場いただいた場合、受付設置のPCで必要事項を各自でご登録いただきます。

ご入場に30分以上掛かることが予想されますので、極力事前登録をご利用ください。

事前入場登録は「分析展2010/科学機器展2010」オフィシャルHPから → <http://www.jaimasis.jp/2010/index.html>

新技術説明会・ブース内セミナー事前登録のお申込み

FAX : 045-339-5871

ご参加希望の新技術説明会、セミナーに☑をお願いいたします。



【新技術説明会】 ※ 開始時間を過ぎててもご来場されない場合は、先着順とさせていただきます。

9/1(水)	<input type="checkbox"/>	11:35～12:25	部屋: A-10	無機分析	★始まりはいつもパーキンエルマー★ 新次元ICP-MS『NexION 300シリーズ』-半導体分析編-
	<input type="checkbox"/>	14:50～15:40	部屋: A-9	熱分析	教えます！DSCの活用法 DSCはHyphenationへ
9/2(木)	<input type="checkbox"/>	10:30～11:20	部屋: A-11	無機分析	★始まりはいつもパーキンエルマー★ 新次元ICP-MS『NexION 300シリーズ』-環境・食品分析編-
	<input type="checkbox"/>	12:40～13:30	部屋: N-5	クロマトグラフ分析	決定版！GC, GC/MS分析と新しいサンプリング技術
9/3(金)	<input type="checkbox"/>	10:30～11:20	部屋: N-5	無機分析	★Solution Package★ 無機分析における最適な装置選択と分析手法の提案 ～マイクロウェーブ酸分解からAAS,ICP-OES,ICP-MSまで～
	<input type="checkbox"/>	12:40～13:30	部屋: A-8	分子分光分析	パーキンエルマーFTIRの新製品と最新技術の紹介
	<input type="checkbox"/>	13:45～14:35	部屋: N-4	クロマトグラフ分析	知って得する、新規UHPLCのパフォーマンスを一挙公開！

【ブース内セミナー】(所要時間:約15分) ※開始5分前までににご来場ください。それ以降は、先着順でご案内いたします。

9/1(水)	<input type="checkbox"/>	10:15	無機-3	ついにでた！新世代ICP-MS『NexION300シリーズ』の実力 ～環境・食品分析編～
	<input type="checkbox"/>	11:00	分光-2	UV/Vis分光光度計の最新アプリケーション ～太陽電池・環境・光学～
	<input type="checkbox"/>	11:45	熱-1	DSC-Ramanが問題の核心にせまる！
	<input type="checkbox"/>	12:30	クロ-1	環境や食品を取り巻く微量化学物質の濃縮分析 ～濃縮法HS,サーマルデソーバーを用いたGCMS分析～
	<input type="checkbox"/>	13:15	熱-2	発生ガス分析が試料の素性を明らかにする！
	<input type="checkbox"/>	14:00	分光-1	FTIRとIRイメージングのアドバンスドテクニック
	<input type="checkbox"/>	14:45	無機-1	これならわかる！原子吸光法の基礎と活用法 ～食品・材料分野への応用～
	<input type="checkbox"/>	15:30	クロ-3	満を持して登場！操作圧力・流速範囲が拡張したUHPLC"Flexar"の優れたパフォーマンス ～環境・食品分野における高速分析～ さらに最新情報を提供、新製品LC/MSのご紹介
9/2(木)	<input type="checkbox"/>	16:15	LS	OneSource ～製薬企業におけるラボ機器のクオリフィケーション要求事項～
	<input type="checkbox"/>	10:15	クロ-2	低エミッション化学製品のオフガス分析を見る(ATD, HS-GCMS)
	<input type="checkbox"/>	11:00	熱-1	DSC-Ramanが問題の核心にせまる！
	<input type="checkbox"/>	11:45	クロ-3	満を持して登場！操作圧力・流速範囲が拡張したUHPLC"Flexar"の優れたパフォーマンス ～環境・食品分野における高速分析～ さらに最新情報を提供、新製品LC/MSのご紹介
	<input type="checkbox"/>	12:30	無機-2	これならわかる！ICP-OESの基礎と活用法 ～食品・環境分野への応用～
	<input type="checkbox"/>	13:15	分光-2	UV/Vis分光光度計の最新アプリケーション ～太陽電池・環境・光学～
	<input type="checkbox"/>	14:00	分光-1	FTIRとIRイメージングのアドバンスドテクニック
	<input type="checkbox"/>	14:45	無機-4	ついにでた！新世代ICP-MS『NexION300シリーズ』の実力 ～半導体分析編～
9/3(金)	<input type="checkbox"/>	15:30	熱-2	発生ガス分析が試料の素性を明らかにする！
	<input type="checkbox"/>	16:15	LS	OneSource ～製薬企業におけるラボ機器のクオリフィケーション要求事項～
	<input type="checkbox"/>	10:15	分光-2	UV/Vis分光光度計の最新アプリケーション ～太陽電池・環境・光学～
	<input type="checkbox"/>	11:00	クロ-1	環境や食品を取り巻く微量化学物質の濃縮分析 ～濃縮法HS,サーマルデソーバーを用いたGCMS分析～
	<input type="checkbox"/>	11:45	クロ-3	満を持して登場！操作圧力・流速範囲が拡張したUHPLC"Flexar"の優れたパフォーマンス ～環境・食品分野における高速分析～ さらに最新情報を提供、新製品LC/MSのご紹介
	<input type="checkbox"/>	12:30	熱-1	DSC-Ramanが問題の核心にせまる！
	<input type="checkbox"/>	13:15	無機-4	ついにでた！新世代ICP-MS『NexION300シリーズ』の実力 ～半導体分析編～
	<input type="checkbox"/>	14:00	熱-2	発生ガス分析が試料の素性を明らかにする！
	<input type="checkbox"/>	14:45	無機-3	ついにでた！新世代ICP-MS『NexION300シリーズ』の実力 ～環境・食品分析編～
	<input type="checkbox"/>	15:30	分光-1	FTIRとIRイメージングのアドバンスドテクニック
	<input type="checkbox"/>	16:15	LS	OneSource ～製薬企業におけるラボ機器のクオリフィケーション要求事項～

お名前			
貴社名		ご所属	
ご住所			
TEL		FAX	
E-mail			
通信欄			

株式会社パーキンエルマー・ジャパン
www.perkinelmer.co.jp

分析機器事業部

〒240-0005 横浜市保土ヶ谷区神戸町134
横浜ビジネスパーク テクニカルセンター4F
TEL: 045-339-5861, FAX: 045-339-5871